

열화시간에 따른 적외선 방출특성

유나름, 이준호, 오필용, 문민욱, 정진만, 고병덕, 송기백, 임정은, 이해정, 이수범,
손창길, 정세훈, 한용규, 최은하

광운대학교 전자물리학과 / PDP 연구센터

PDP는 플라스마로부터 방사되는 진공자외선을 이용한다. 그렇기 때문에 Xe 원자로부터 기인되는 진공자외선의 특성을 연구하는 것이 선행되어야 한다. 진공자외선과 적외선과는 밀접한 상호관계를 지닌다. 진공자외선 147nm는 적외선 828nm에, 진공자외선 173nm는 적외선 823nm에 관계됨을 볼 수 있다^[1]. 이에 따라 이번 실험에서는 72시간 동안의 열화에 따른 적외선 방출 현상을 살펴보았다. 분광분석 실험 장치로는 단색분광기를 이용하였으며 He(50%)-Ne-Xe(10%)의 혼합기체, 전극 폭 300um, ITO Gap 90um의 4인치 테스트 패널을 이용하였다.

[참고문헌]

1. J. C. Ahn, T. Y. Kim, J. J. Ko, Y. Seo, G. S. Cho, and E. H. Choi, J. Appl. Phys. 87, 8045 (2000).